

Федеральное агентство  
по техническому регулированию и метрологии  
(Ростехрегулирование)  
**НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ СВОЙСТВ  
ПОВЕРХНОСТИ И ВАКУУМА  
(НИЦПВ)**

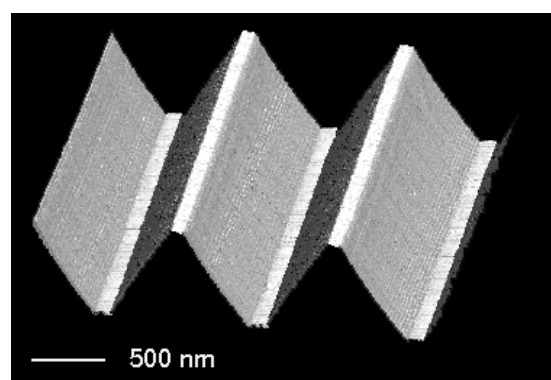
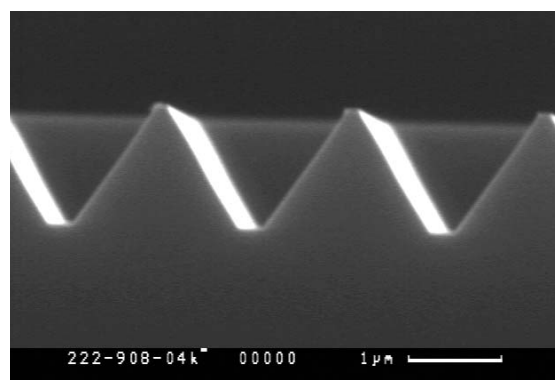
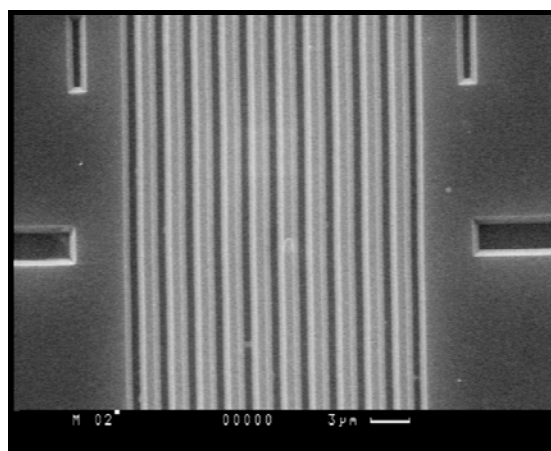
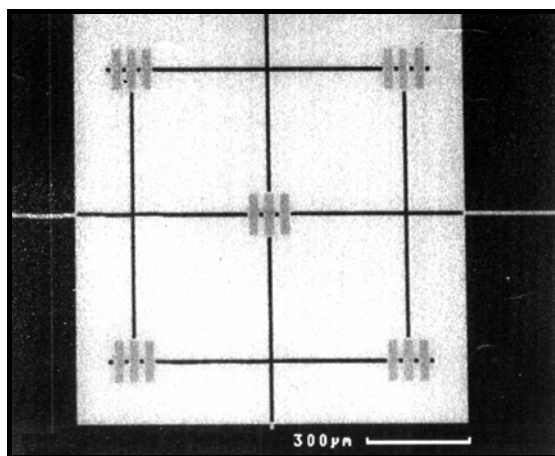
Российская Академия наук  
**ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ ФИЗИКИ**

**Эталонная мера ширины и периода *МШПС-2.0К* для  
растровой электронной и атомно-силовой микроскопии**

Эталонная 3-х мерная шаговая мера *МШПС-2.0К* предназначена для калибровки средств измерений линейных размеров, применяемых в микроэлектронике и нанотехнологии:

**Калибровка РЭМ (5 минут):** увеличение, диаметр электронного зонда.  
**Калибровка АСМ (5 минут):** цена деления по *X*-, *Y*-, *Z*-координатам,  
радиус острия кантилевера,  
линейность и ортогональность осей сканирования.

Номинальный размер шага	2000 нм
Ширина линии	30 ÷ 1500 нм
Высота (глубина) рельефа	100 ÷ 1500 нм
Погрешность аттестации:	
шаг	±1 нм
ширина линии	±1 нм
высота (глубина) рельефа	±1 %



119421, Россия, Москва,  
ул. Новаторов, д. 40, корп. 1  
НИЦПВ  
Телефон: (007-095) 935-97-77  
Тел./факс: (007-095) 935-96-90  
E-mail: fgupnicpv@mail.ru

119991 Россия, Москва  
ул. Вавилова, 38  
Институт общей физики РАН  
Телефон: (007-095) 135-78-05  
E-mail: nya@kapella.gpi.ru